

## 第 85 回 FTC 研究会 (2022 年 7 月 29 日)

\*ハイブリット開催のため当初よりプログラムを変更しております。

13:00-13:10 オープニング

セッション 1 テスト関連技法

13:10-13:40 高精度アナログ IC 試験での熱起電力の影響

○飯森大翼, 中谷隆之, 片山翔吾, 荻原岳, 趙宇杰, 魏江林, 桑名杏奈, 加藤健太郎,

畠山一実, 小林春夫(群馬大), 佐藤賢央, 石田崇, 岡本智之, 市川保 (ローム(株))

13:40-14:10 深層強化学習を用いた検査点の選定法

○魏少奇, 塩谷晃平, 王森レイ, 甲斐博, 樋上喜信, 高橋寛 (愛媛大)

14:10-14:40 アルゴリズム的にテストパターン生成可能なバウンダリスキャンテストの開発

○竹本健太, 土屋秀和, 浅川毅 (東海大)

14:40-15:10 多信号含意を利用したコンカレントエラーディテクションについて

○甲斐 康行, 宮瀬紘平, 梶原誠司 (九工大), 井置一哉 (ローム(株))

15:10-15:20 休憩

セッション 2 高信頼化関連技法&国際会議報告

15:20-15:50 導通関数における論理モードを利用した高信頼化

古賀義亮, ○竹之上典昭 (防衛大)

15:50-16:20 ハードウェア欠陥における AI アクセラレーターの機能安全性に関する研究

Stefan Holst, ○Lim Bumun, Xiaoqing Wen (九工大)

16:20-17:00 国際会議報告: VTS2022

○畠山一実 (群馬大/EVALUTO/日本アクティブキャリア開発)

17:00-17:20 各種連絡事項

17:20-17:30 クロージング